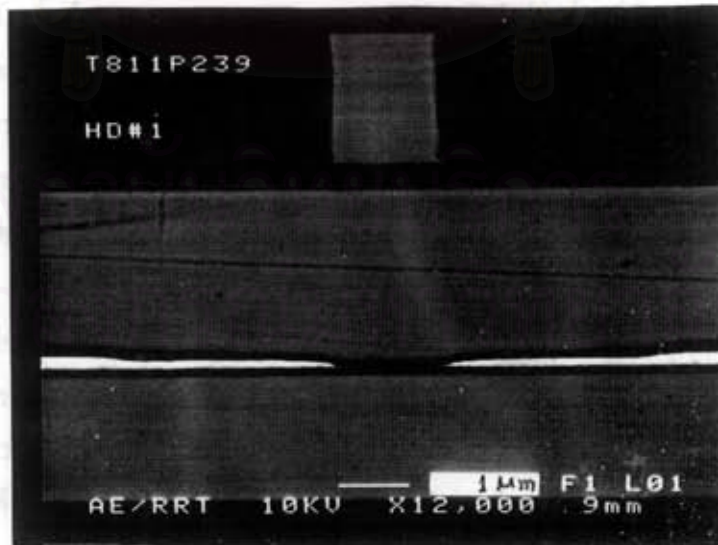




1.1 สภาพความเป็นมา แนวทางเหตุผลและปัญหา

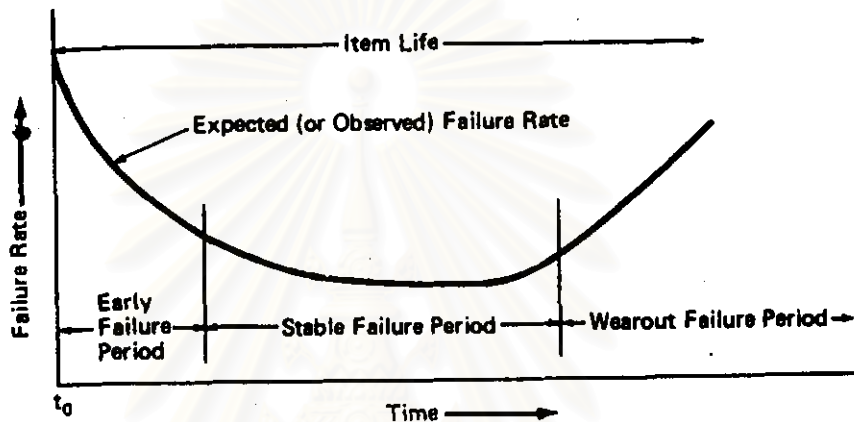
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นมากในการเพิ่มความจุของฮาร์ดดิสก์ไครฟ์ ความเร็วการทำงาน และประสิทธิภาพ ผลจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ทำให้วิศวกรที่ทำงานทางด้านทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability Engineer) ของผลิตภัณฑ์ต้องคิดค้นและหาวิธีการทดสอบทางด้านความเชื่อถือได้ทางด้านคุณภาพในการทำงานของผลิตภัณฑ์ อัตราการทำงานประดัย และ การทำนายอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ด้วยระยะเวลาอันสั้น ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตหัวอ่านเขียนสำหรับฮาร์ดดิสก์ไครฟ์ มีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยเพียง 9 เดือน ทำให้วิศวกรทางด้านทดสอบความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ต้องคิดค้นและหาวิธีในการทดสอบด้วยระยะเวลาอันสั้นด้วย

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการความเร็วและความสูงทำให้หัวอ่านเขียนต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยพัฒนาจากหัวอ่านเขียนแบบอินдукทีฟ (Inductive Head) มาเป็นหัวอ่านเขียนแบบแมกนีโทริซิสทีฟ ซึ่งมีโครงสร้างที่ต่างกัน โดยหัวอ่านเขียนจะมีโครงสร้างที่เพิ่มขึ้นคือแมกนีโทริซิสทีฟสไตรป์ (Magnetoresistive Stripe) ซึ่งเป็นฟิล์มบางที่มีความหนาเพียง 150 Å และมีความกว้างประมาณ 1.5-2 ไมครอน ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 ภาพถ่าย Scanning Electron Microscopy หัวอ่านเขียนแบบแมกนีโทริซิสทีฟ (Magnetoresistive Head)

แมกนีโทริซิสทีฟไดรฟ์เป็นส่วนที่เป็นปัจจัยหลักทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีผลโดยตรงต่อการเกิดการประลัย เนื่องจากเป็นฟิล์มโลหะอัลลอยที่เป็นส่วนผสมระหว่างเหล็ก 18 % และ นิกเกิล 82 % และมีความหนาประมาณ 150-250 Å ทำให้เกิดการประลัยสูง เนื่องจากไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Discharge ; ESD) ในขบวนการผลิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทำให้อัตรการประลัยในช่วงแรกสูงของกราฟรูปร่างนำสำหรับอัตราการประลัย (Bathtub Curve for Failure Rate) ดังรูปที่ 1.2



รูปที่ 1.2 แสดงกราฟรูปร่างนำสำหรับอัตราการประลัย

รูปที่ 1.2 แสดงกราฟรูปร่างนำสำหรับอัตราการประลัย ซึ่งแบ่งเป็นสามช่วงคือ ช่วงแรกคือ ช่วงการประลัยในตอนต้น (Early Failure Period) ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่มีคุณภาพไม่ดีจะประลัยในช่วงนี้ ช่วงที่สองเป็นช่วงการประลัยที่มีอัตราคงที่ (Stable Failure Period) ซึ่งเป็นแนวราบที่ยาว อัตราการประลัยเป็นการกระจายแบบสุ่มที่เป็นยูนิฟอร์มหรืออัตราคงที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกาใช้งาน ช่วงสุดท้ายเป็นช่วง Wearout Period อัตราการประลัยจะเกิดสูงขึ้น วัตถุประสงค์อันหนึ่งของการทดสอบความน่าเชื่อถือคือทำให้ช่วงสุดท้ายนี้ให้ห่างออกจากช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ในการใช้งานจะมีกระแส (Current I) ไหลผ่านแมกนีโทริซิสทีฟซึ่งเป็นฟิล์มโลหะอัลลอย ทำให้เกิดปรากฏการณ์อเล็กโทรไมเกรชัน ทำให้ฟิล์มโลหะอัลลอยเริ่มเสื่อมสภาพและมีค่าความต้านทานสูงขึ้นตามระยะเวลาการใช้งาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวสามารถนำปรากฏการณ์อเล็กโทรไมเกรชันมาใช้ในการทดสอบทางด้านความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์และหาโมเดลในการทำนายอายุการใช้งาน

ผลสุดท้ายของงานวิจัยนี้ จะได้แนวทางและวิธีการทดสอบและโมเดลในการทำนายอายุการใช้งานของหัวอ่านเขียนแบบแมกนีโทริซิสทีฟ โดยวิธีการทดสอบแบบอเล็กโทรไมเกรชัน แนวทางการ

ดำเนินการทดสอบดังกล่าวยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับมาร์จินอล (บริเวณที่เป็นพรมแดนระหว่างช่วงแรกและช่วงที่ 2 ของกราฟอัตราประจักษ์รูปอย่างน้ำในรูปที่ 3) เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลุดไปถึงลูกค้า นอกจากนี้สามารถใช้ในการประยุกต์หาโมเดลการทำนายอายุของผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตได้ เช่น หัวอ่านเขียนแบบดualแมกเน็ทโรซิสทีฟ (Dual Magnetoresistive Head) เป็นต้นยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลการทดสอบดังกล่าวยังสามารถไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์แมกเน็ทโรซิสทีฟโมเดลใหม่ได้

1.2 วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์

เพื่อประยุกต์วิธีการทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไมเกรชันกับหัวอ่านเขียนแบบแมกเน็ทโรซิสทีฟ ในการทดสอบความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ และหาโมเดลในการทำนายอายุของผลิตภัณฑ์

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์หัวอ่านเขียนแบบแมกเน็ทโรซิสทีฟ เพื่อใช้ในการทดสอบความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ไมเกรชัน เพื่อใช้หาโมเดลในการทำนายอายุของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการทดสอบดังนี้

1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ กระแสไฟฟ้าตรง และความต้านทานของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบ เนื่องจากในแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีการออกแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกอย่างน้อยสองผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการทดสอบ
2. วัสดุอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น สายไฟ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปหรือไม่
3. เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ โดยพิจารณาจากความเที่ยงตรง (Precision) และความแม่นยำ (Accuracy) ของเครื่องมือ
4. ปัจจัยอื่น ๆ ได้กำหนดไว้ในสมมติฐานของการวิจัย

1.4 ข้อสมมติฐานของการวิจัย

เนื่องจากการทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไมเกรชัน โดยมากจะทดสอบโดยใช้ตัวอย่างเป็นฟิล์มโลหะหรืออัลลอย ทำให้สามารถหาค่าของตัวแปรหรือปัจจัยได้โดยการวัดโดยตรง แต่การทดสอบแบบ

อิเล็กทรอนิกส์หัวอ่านเขียนแมกนีโทริซิสทีฟที่สร้างรูปเป็น HGA (Head Gimbal Assembly) ซึ่งเป็นการยากที่จะวัดค่าความต้านทานโดยตรง ดังนั้นเพื่อความสะดวกต่อการวิจัย จึงขอตั้งสมมติฐานเบื้องต้นไว้ดังนี้

1. ให้ความต้านทานของ MR Element มีค่าเท่ากับค่าความต้านทานของ MR HGA ซึ่งจะรวมกับวัสดุตัวนำภายในและชุดสายไฟพร้อมบอร์ด การทดสอบนี้จะทดสอบในรูปของ HGA ค่าความต้านทานที่อยู่ในรูปสไลเดอร์สามารถหาได้โดยการนำค่าความต้านทานของลวดไฟฟ้า (5 โอห์ม) ลบด้วยค่าความต้านทานของหัวอ่านเขียนแมกนีโทริซิสทีฟ
2. ในการประเมินอายุของ MR Head จะพิจารณาว่าหัวอ่านเขียนดังกล่าวประจักษ์ก็ต่อเมื่อค่าความต้านของ MR เพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 5%
3. สมมติให้มีกระแสไฟตรงไหลผ่าน MR layer ประมาณ 70 % ของกระแสทั้งหมด และมีค่าความหนาของ MR คงที่ทุกตัว ซึ่งค่าดังกล่าวจะมาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการยากที่จะวัดขนาดของความหนาของ MR เพราะมีความหนาเพียง 150 Å
4. อุณหภูมิในการใช้งานเท่ากับ 60 °C หรืออาจจะพิจารณาอุณหภูมิในการใช้งานระดับอื่นได้แล้วแต่กรณี
5. รอบของการใช้งานของฮาร์ดดิสก์ประมาณ 50% ซึ่งอาจจะพิจารณาการรอบการใช้งานระดับอื่นได้ เช่น 75% หรือ 100% แล้วแต่กรณี
6. เพื่อความสะดวกในการวิจัย ตัวแปรหรือปัจจัยอื่นๆ อาจจะต้องอ้างอิงจากผู้วิจัยท่านอื่นๆ หรือหนังสืออ้างอิง

1.5 ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาวิธีการทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์หัวอ่านเขียนแมกนีโทริซิสทีฟ
2. ดำรงงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอายุการใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์หัวอ่านเขียนแมกนีโทริซิสทีฟ โดยส่วนใหญ่จะมีมากในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
3. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของปัจจัยที่จะมีผลต่อการทดสอบ
4. ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ และหาโมเดลในการทำนายอายุการใช้งานของหัวอ่านเขียนแมกนีโทริซิสทีฟ ปัจจัยที่ต้องศึกษามีดังนี้
 - 4.1 การประมาณค่าความสูงของแมกนีโทริซิสทีฟสไตรป์ (MR stripe Height) จากความต้านทาน โดยเปรียบเทียบกับการวัดจริงโดยการ Cross Section ด้วยการขัดและวัดความสูงของแมกนีโทริซิสทีฟสไตรป์ ด้วยเครื่องสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคป (Scanning Electron Microscope)

- 4.2 การศึกษาปัจจัยของตลาดไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงความผันผวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือไม่
- 4.3 ศึกษาปัจจัยความผันผวนของแมกนีโทริซิตีฟและอุณหภูมิความผันผวนของแมกนีโทริซิตีฟ
5. หารูปแบบวิเคราะห์และโมเดลในการทำนายอายุการใช้งานของหัวอ่านเขียนแบบแมกนีโทริซิตีฟ
6. วิเคราะห์หาโมเดลในการทำนายอายุการใช้งานของหัวอ่านเขียนแบบแมกนีโทริซิตีฟ
7. สรุปผลการวิเคราะห์
8. จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้วิธีการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ไมเกรชั่นในการทดสอบความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์
2. ได้วิธีการทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ไมเกรชั่นในการประเมินอายุการใช้งานของหัวอ่านแบบแมกนีโทริซิตีฟ
3. สามารถนำวิธีการทดสอบนี้ไปประยุกต์ใช้ในบริษัทเพื่อทดสอบและรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในอนาคตต่อไป
4. สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะมีในอนาคต

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย